

Modelis	SJ 5700 / SJ 5701	SJ 5760
Kontūras mērīšana:		
X ass:		
Mērīšanas diapazons	(0~200) mm	(0~200) mm
Kļūda	$\pm(0,8+2L/100)$ μm , kur L ir horizontālais garums mm	$\pm(1,2+2L/100)$ μm , kur L ir horizontālais garums mm
Izšķirtspēja	0,01 μm	0,01 μm
Taisnība	2 μm / 200 mm	2 μm / 200 mm
Skenēšanas ātrums	(0,1~5) mm/s	(0,1~5) mm/s
Kustības ātrums	(0~30) mm/s	(0~80) mm/s
Z1 ass:		
Mērīšanas diapazons	± 25 mm	± 25 mm
Kļūda	$\pm(1,6+ 2H /100)$ μm , kur H ir izmērītais augstums mm	$\pm(2+ 2H /40)$ μm , kur H ir izmērītais augstums mm
Izšķirtspēja	0,01 μm	0,01 μm
Z ass:		
Mērīšanas diapazons	(0~450) mm	(0~450) mm
Kustības ātrums	(0~30) mm/s	(0~30) mm/s
Mērīšanas spēks		
Mērīšanas spēks	(10~150) mN	(10~150) mN
Maksimālais slīpums	77 ° pieaugums / nolaišanās 83 °	77 ° pieaugums / nolaišanās 83 °
Iestatījumu tabula	Griešanās leņķis: 360 °; X, Y kustība: 15 mm	
Kopējie izmēri	Granīta pamatne: (800 × 450 × 100) mm Mašīna: (850 × 500 × 1100) mm	Granīta pamatne: (800 × 450 × 100) mm Mašīna: (800 × 450 × 1100) mm
Svars	150 kg	140 kg
Nelīdzenuma mērīšana *		
Galvenie parametri:		
Mērīšanas diapazons	X ass: 200 mm Z ass: ± 80 μm / ± 40 μm / ± 20 μm	
Taisnības novirze	$\leq 0,15$ μm / 20 mm, $\leq 0,5$ μm / 200 mm	
Displeja kļūda	± 5 %	
Izšķirtspēja	Z ass 0,04 μm (± 80 μm), 0,02 μm (± 40 μm), 0,01 μm (± 20 μm)	
Skenēšanas ātrums	0,5 mm / s un 0,1 mm / s, regulējams	
Aparatūra:		
Mērīšanas zonde	Standarta: augstums <8 mm, rādiuss - 2 mikroni, statiskais mērīšanas spēks 0,75 mN	
Vertikālā kolonna	Augstums ≥ 450 mm	
Filtrēšana	2RC, Gauss, fāze nulle; Filtru grupas izvēle un veidošana; Filtres un mērīšanas garums saskaņā ar izvēlēto standartu	

* darbojas tikai SJ 5701